

---

**SPRAWOZDANIE  
Z X SZKOŁY-KONFERENCJI MWK'2014  
"METROLOGIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO"**

W dniach 27 ÷ 30 maja 2014 r., w WDW „Warmia” w Waplewie k/Olsztynka, odbyła się jubileuszowa X Szkoła-Konferencja **MWK'2014**.

Wiodącym organizatorem tego spotkania był – podobnie jak wszystkich wcześniejszych – Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wspomagany przez Wojskowe Centrum Metrologii MON oraz Naczelnego Metrologa WP. Honorowy Patronat nad konferencją piastował JM Rektor Wojskowej Akademii Technicznej. Merytorycznego wsparcia całemu przedsięwzięciu udzielił – jak zwykle – Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, a także Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej oraz Sekcja Polska IEEE.

Prace organizacyjne realizował zespół pod kierunkiem przewodniczącego Komitetu Naukowego MWK'2014 prof. Andrzeja Michalskiego, sekretarza Komitetu Naukowego dr. inż. Marka Kuchty oraz przewodniczących Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Tadeusza Dąbrowskiego (WAT) i płk. mgr. inż. Roberta Targosa (WCM MON). Obowiązki „księgowego i kwestora” konferencji pełnił bardzo efektywnie mgr inż. Roman Wrona.

Konferencja „Metrologia Wspomagana Komputerowo” jest od początku swojej działalności nierozdzielnie związana z szeroko rozumianą metrologią wojskową. W tym roku wątkiem przewodnim wykładów (w szkolnej części obrad) była „metrologia mobilna”. Organizatorzy dołożyli wielu starań by mobilność narzędzi i metod pomiarowych – tak ważnych w metrologii wojskowej – została należycie zaakcentowana. Dowodem na to m. in. była towarzysząca konferencji, bogata ekspozycja zestawów pomiarowych znajdujących się na wyposażeniu polskich wojskowych ośrodków metrologicznych.

Biorąc pod uwagę, że na mocy założeń, obrady miały obejmować nie tylko referaty konferencyjne ale także „szkolne” wykłady, Komitet Naukowo-Organizacyjny MWK zamówił dziesięć 45-minutowych prelekcji. Siedem z tych zamówionych wykładów zawartych jest w monografii pt. *„Wybrane aspekty mobilnych systemów pomiarowych”* opracowanej i wydanej pod naukową redakcją prof. Andrzeja Michalskiego. Dzieło to liczy 235 str. (ISBN 978-83-7938-020-6).

Na konferencję zgłoszono 88 referatów. Z tej liczby do druku, w punktowanych czasopiśmie, aplikowało 77 prac. Pozytywnie proces recenzowania przeszło 62 opracowania. Teksty te po niezbędnych uzupełnieniach i odpowiednim sformatowaniu zostaną skierowane do druku w następujących periodykach: w Przeglądzie Elektrotechnicznym, w PAK (Pomiary Automatyka Kontrola) oraz w Biuletynie WAT. Pozwoli to uzyskać uczestnikom konferencji dodatkową korzyść, szczególnie istotną z punktu widzenia oceny parametrycznej ich macierzystych jednostek.

O uznaniu środowiska metrologicznego dla organizowanej cyklicznie Szkoły-Konferencji może świadczyć fakt, że tegoroczną edycję konferencji uświetnili swoją obecnością m. in. JM Rektor WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN prof. Marian Kaźmierowski, Prezes GUM Pani Janina Popowska, V-przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN prof. Janusz Gajda. W obradach wzięli także udział goście z Ukrainy – 3 profesorów z Politechniki Lwowskiej.

Szkoła-Konferencję MWK'2014 charakteryzuje następująca statystyka:

- liczba uczestników: 155 (w tym uczestników merytorycznie aktywnych: 148 osób);
- liczba wykładów: 10 (w tym 9 wygłoszonych);
- liczba nadesłanych referatów: 88 (w tym 85 zaprezentowanych);
- liczba sesji plenarnych: 5;
- liczba sesji sekcyjnych werbalnych: 6;
- liczba sesji sekcyjnych plakatowych: 4.

Na wyróżnienie – za liczny udział swoich pracowników w MWK'2014 – zasługują następujące jednostki organizacyjne: Ośrodki Metrologii Wojskowej (44 osoby), WAT (36 osób), Politechnika Warszawska (15 osób).

Materiały konferencyjne składają się z tomu ze streszczeniami referatów (192 str.) oraz z pendrive'a zawierającego pełne, na prawach nierecenzowanego rękopisu, teksty nadesłanych referatów.

Szkoła-Konferencja MWK'2014 pozwoliła uczestnikom zacieśnić wzajemne kontakty oraz wymienić aktualne doświadczenia i informacje odnoszące się do badań i praktycznych metod pomiarowych.

Wartościowym elementem konferencji była ekspozycja sprzętu pomiarowego oferowanego przez 4 uczestniczące w konferencji firmy: NDN Daniluk (Warszawa), DIGIMES (Warszawa), AM Technologies Polska (Warszawa), Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej – TYBO (Mysłowice). *TYBO nie eksponowała sprzętu, jedynie miała kilkunastominutowe wystąpienie prezentujące jej ofertę handlową.*

Organizatorzy MWK'2014 zadbali także o to by w programie przedsięwzięć konferencyjnych znalazły się elementy sprzyjające rekreacji. Do takich wydarzeń niewątpliwie należy znakomity koncert wojskowej orkiestry garnizonowej z Elbląga oraz integracyjna biesiada „przy ognisku”.

W trakcie dyskusji pomiędzy członkami Komitetu Naukowego sformułowano wniosek by podjąć starania o połączenie konferencji MWK z inną cykliczną konferencją realizowaną także przez Instytut Systemów Elektronicznych WEL WAT, a mianowicie z konferencją „Diagnostyka Urządzeń i Systemów DIAG”. Fuzja taka wydaje się możliwa, bo merytorycznie obszary metrologii i diagnostyki są kompatybilne i wzajemnie się uzupełniają. Korzyścią wynikającą z takiego kroku może być wzrost liczby uczestników połączonej konferencji.

Ankieta ocenowa przeprowadzona wśród uczestników MWK'2014 dała następujące dane uśrednione (w skali ocen szkolnych 1-6):

- poziom wykładów: 5,54;
- poziom referatów: 5,36;
- poziom organizacji: 5,27.

Można zatem uznać, że Szkoła-Konferencja spełniła oczekiwania uczestników i może stanowić podstawę do satysfakcji dla organizatorów.

*Opracowali:*

Dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski

Dr inż. Marek Kuchta

**Załączniki:**



Foto-1. Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego w oczekiwaniu na uczestników konferencji  
*Od lewej: Agnieszka Bubula, Ewa Budna, Roman Wrona*



Foto-2. Sesja plenarna (inauguracyjna).  
*Od lewej: płk. R. Targos – Naczelnny Metrolog WP, prof. A. Michalski, prof. T. Dąbrowski, prof. M. Wnuk – dziekan WEL WAT*



Foto-3. Widok ogólny sali obrad podczas sesji plakatowej  
*Na pierwszym planie od lewej: dr inż. Z. Watral*